

## USPTO 特許と商標の審査便覧を改訂

2015年11月10日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

米国特許商標庁(以下、USPTO)は、審査基準にあたる特許審査便覧([Manual of Patent Examining Procedure :MPEP](#))<sup>1</sup>及び商標審査便覧([Trademark Manual of Examining Procedure :TMPEP](#))を改訂した。

今般の改訂は、2012年特許法条約実施法(Patent Law Treaties Implementation Act of 2012)に関連する法律、規則および実務の変更や、5月に発効したハーグ条約に対応する修正及び最近の商標の判例に対応するためのものである。

<MPEP>第9版(2015年11月更新)

改定の概要:

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0005-change-summary.html>

- 特許法条約実施法(Patent Law Treaties Implementation Act:PLTIA)に関連し、第600章(出願日要件:図面やクレームがない出願などの取り扱いなど)<sup>2</sup>を中心に改訂。
- 特許法条約(Patent Law Treaty)に関連し、優先権の回復のため、先の出願から12ヶ月を超えた場合であっても、二ヶ月の猶予期間を与える。
- 意匠の国際登録に関するハーグ協定の発効に対応するため、第2900章(国際意匠出願)を追加。その他に、第1500章(Design Patent)及び第200章について当協定に関連し修正。

<TMPEP>2015年10月版

改定の概要:

<http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMPEP/current/d1e2.xml#/manual/TMPEP/current/changed1e1.xml>

- 15年10月1日以前に下された判決のうち、商標実務に関連するものを反映。
- Trademark Examination Guides<sup>3</sup>と平仄を合わせるための改正。

<sup>1</sup> 米国ではMPEPに意匠も含まれている

<sup>2</sup> [改定前の訳文](#)(日本国特許庁サイトより)

<sup>3</sup> <http://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/trademark-examination-guides>